

JACA No.45-2007

クリーンルームおよび関連する制御環境中における分子状汚染物質に関する表面清浄度の表記方法および測定方法指針

1. 適用範囲
2. 用語の意味
3. 清浄度の表記方法
 - 3.1 X_{SMC} 表示（酸性物質(Acids)、塩基性物質(Bases)、有機物質(Organic compounds)）
 - 3.2 SMC の清浄度クラス（酸性物質(Acids)、塩基性物質(Bases)、有機物質(Organic compounds)）
 - 3.3 X_{SMC-atomic} 表示（ドーパント(Dopant)、金属(Metals)）
 - 3.4 表記法
4. SMC の濃度測定法
 - 4.1 酸性物質の場合
 - 4.2 塩基性物質の場合
 - 4.3 有機物質の場合
 - 4.4 ドーパント類の場合
 - 4.5 金属の場合
5. 注意事項
 - 5.1 ブランクの低減
 - 5.1.1 基板のブランク低減
 - 5.1.2 測定におけるブランク低減
 - 5.1.3 前処理・分析環境のブランク低減
 - 5.2 精度の検証
6. 試験結果の報告
 - 解説 1. 曝露時間と表面濃度の関係
 - 解説 2. 表面濃度単位の換算方法